

TOSHIBA

歩留分析ソリューション 参考出展

検査工程での測定データから異常値を自動で検出、原因となった製造工程を推定し、高度な歩留改善を支援

Point
1

検査値の分布から異常値を自動検出

検査工程で測定したデータの外れ値やばらつき具合をロットや時間単位で表示し、異常値の範囲を自動で検出

Point
2

製造条件と異常値の組合せで原因工程を推定

工程内の製造条件の差異による異常発生の変りを分析し、原因工程の候補をランキング表示

Point
3

膨大な検査項目からスキルレスで異常や原因工程を検出

数千の検査データから異常の発生とその原因工程を早期に発見可能
東芝グループ工場でサービス化に向け、歩留改善の効果を検証中

